

固体材料表面分析生物样品微区成像二次离子质谱技术测试服务

产品名称	固体材料表面分析生物样品微区成像二次离子质谱技术测试服务
公司名称	杭州微源检测技术有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:微源检测 检测周期:*快一天，平均三天 报告形式:中英文
公司地址	浙江省杭州市余杭区良渚街道通运街366号1幢206室
联系电话	17366631625

产品详情

二次离子质谱是固体材料表面分析的一项重要技术。SIMS对元素的检测限非常高，可达到ppm甚至ppb级。该仪器能分析含H-U的各种元素和同位素，能分析官能团、分子结构等信息，在半导体、材料、矿物、化工、生物医学等领域得到了广泛的应用。SIMS的原理是将具有一定能量（通常为几百至几万eV）的初级离子束轰击到固体表面，样品表面的一些粒子被溅射出去，其中一些带电离子被质谱检测分析后得到样品化学成分信息。SIMS按扫描方式可分为静态SIMS(SSIMS)和动态SIMS(DSIMS)两种。

SSIMS要求真空度小于 10^{-7} Pa、电子束能量小于5keV，与此同时，在低密度束的情况下轰击材料微区，从而保证只有若干层原子原子被激发。这种扫描方式对样品破坏性小，通常可以用来分析有机物结构或表面微区二维成像。DSIMS使用高能量、高密度离子束层层剥离材料，分析溅射粒子，检测不同深度下的二次离子信息，动态分析三维空间中材料元素的分布。如今TOF质谱检测器在SIMS技术用的多，TOF-SIMS的分辨率可以达到 10^4 ，深度分辨率达到1nm，微区分辨率达到 100nm^2 ，二次离子浓度灵敏度达到ppm级别。随着仪器性能的发展，TOF-SIMS的应用范围也慢慢扩大。TOF-SIMS在生物医学领域的发展也日益迅速，这是其它质谱(ESI-MS、MALDI-MS)或表面分析技术(EDS、XPS)所没有的特殊性质。TOF-SIMS的超高分辨率和化学成像在研究生物组织结构、细胞界面、分子行为等方面发挥着重要的作用。杭州微源检测提供先进的TOF-SIMS仪器检测服务，可为客户提供完善的SIMS技术解决方案。

检测流程：1、沟通需求：了解样品检测项目，确定检测范围；

2、签订合同：根据检测项目及检测需求报价并签订合同及保密协议；

3、寄送样品：快递样品至实验室；4、样品检测：实验室进行检测流程，具体可咨询专属检测顾问；

5、寄送报告：出具检测报告，并进行后期服务

实验室仪器：

服务优势：杭州微源检测技术有限公司是科创板上市公司泰坦科技股票代码：688133) 注资成立的一家独立第三方生物医药研发测试服务公司，遵照ISO17025和GMP进行实验室管理，通过CMA和CNAS双认证，可谓医药行业提供产品研发测试，元素杂质检测，基因毒性杂质研究，结构确证，生物药工艺残留物检测等系列服务，专注为药物生产过程中可能产生的各类残留物和杂质提供检测服务、方法学开发、方法学验证及评估报告等一系列完整解决方案并提供相应分析测试报告。